(54) ACTIVE MATRIX PANEL

(11) 1-68724 (A) (43) 14.3.1989 (19) JP

(21) Appl. No. 62-225710 (22) 9.9.1987

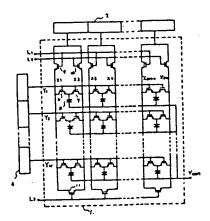
(71) SEIKO EPSON CORP (72) YOJIRO MATSUEDA

(51) Int. Cl⁴. G02F1/133,G09F9/30,H01L21/82,H01L29/78

PURPOSE: To correct a line defect and a point defect by providing a specific number of signal lines and a specific number of picture elements TFT and

giving redundancy to both of them.

CONSTITUTION: The active matrix panel consists of 2M signal lines X_1 , $X_2 \sim X_{2M}$, N scanning lines $Y_1 \sim Y_N$, M×N element electrodes, two picture element thin film transistors (TFT)6 and 7 whose drain electrodes are connected to one of the picture element electrodes in common, switches TFT9~TFT11 provided to input parts and terminals of the signal lines, and bus lines $L_1 \sim L_3$ which turn on and off the switch TFTs. Thus, the signal lines and picture elements TFT6 and TFT7 have redundancy, so a line defect and a point defect can be corrected and the TFT switches 9~11 at the input parts of the signal lines select odd-numbered and even-numbered signal lines independently to easily detect the address of a refractive part.



2: X driver, 4: Y driver

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-68724

<pre>⑤Int Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号	❸公開	昭和64年(1989)3月14日
G 02 F 1/133 G 09 F 9/30 H 01 L 21/82 29/78	3 2 7 3 3 8 3 1 1	7370-2H 7335-5C 7925-5F A-7925-5F	審査請求 未請求	- 発明の数 1 (全 5 頁)

49発明の名称

アクテイブマトリクスパネル

の特 願 昭62-225710

❷出 頤 昭62(1987)9月9日

明 者 ⑫発 松枝

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

セイコーエプソン株式 创出 願 人

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

砂代 理 人 弁理士 最上 外1名 務

1. 発明の名称

アクティブマトリクスパネル

2. 特許請求の範囲

.(1)絶縁基板上に、複数の走査線、信号線、及び それらの交点に配置された薄膜トランジスタ(以 下TFTと略記)と絵業電極とを傾え、液晶を駆 動して成るアクティブマトリクスパネルにおいて、 2 M本の信号線とN本の走査線、及びM×N個の 絵素電極と、各絵素電極の1つにドレイン電極が 共通に接続された2つのTFTを備え、前記2つ のTFTのソース電極は隣接する2本の信号線に ゲート電極は共通の走査線にそれぞれ接続され、 前記信号線と外部ドライバーとの接続部または奇 数番目と偶数番目の信号線の終端間にTFTスィ ッチアレイを煽えていることを特徴とするアクテ ィプマトリクスパネル。

(2)前記2 M本の信号線の入力端に2 M個のTF

Tスイッチアレイを備え、前記2M個のTFTの ソース電極はそれぞれ2M本の信号線に接続され、 ドレイン電極は2個ずつ対をなして外部ドライバ 一に接続され、ゲート電極は奇数番目と偶数番目 のものがそれぞれ共通のバスラインに接続されて いることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載 のアクティブマトリクスパネル。

(3) 前記2 M本の信号線の、奇数番目の終端にド レイン電極、偶数番目の終端にソース電極が接続 され、ゲート電極は共通のバスラインに接続され たM個のTFTスイッチアレイを備えていること を特徴とする特許請求の範囲第2項記載のアクテ ィプマトリクスパネル。

3. 発明の詳細な説明

〔産築上の利用分野〕

本発明はアクティブマトリクスパネルの欠陥数 済方式に関する.

〔従来の技術〕

従来のアクティブマトリクスパネルの例として

特開昭64-68724(2)

は「日経エレクトロニクス 1984年9月10日号 no.351 p.211—240」に示されるようなものがあった。第2図にその回路図の例を示す。21はアクティブマトリクスエリアで、信号線×1、×1、×1、走査線×1、×1、
Y×、及びそれらの交点に配置されたTFT26とから成る。28は、TFT26に接続された絵素電極と共通電極との間の液晶の容量である。信号線は×ドライバー22で、走査線はYドライバー24で駆動する。

(発明が解決しようとする問題点)

しかし、前述の従来技術には以下に述べるような本質的な問題点がある。すなわち、アクティブマトリクスパネルは、大面積に数万~数百万個もの能動素子及び同数のクロスポイントを持つ配線を形成するため、無欠陥のパネルを作るのが極めて難しいという点である。特に画面サイズの大型化、画面の高精細化に伴い歩留まりは一層低下する。

一般に、アクティブマトリクスパネルの欠陥は、

本発明の上記の構成によれば、信号線と絵案TFTの双方に冗長性を有しているため、線欠陥のび点欠陥の修正が可能である。また、信号線のの力部のTFTスイッチにより、奇数番目と偶数数日の信号線を独立に選択でき不良部分のアドレスを簡単に検出できる。また、奇数番目と偶数番ス目の信号線の終端間のTFTスイッチを閉じると自動的に信号線の断線による線欠陥は無くなる。

(実施例1)

 配線の断線、短絡に基づく線欠陥と、TFTに基づく点欠陥に分けられる。前者については配線の終端から給電することで修正は可能だが、非効率的な作業であり、修正部分の信頼性も不充分で実用的でない。後者については修正は不可能である。

本発明はこのような問題点を解決するものであり、その目的とするところは、線欠陥、点欠陥が 簡単に修正でき、無欠陥化が可能なアクティブマ トリクスパネルを実現するところにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明のアクティブマトリクスパネルは、2M本の信号線とN本の走査線、及びM×N個の絵素電極の1つにドレイン電極が共通に接続された2つのTFTを備え、前記2つのTFTのソース電極は隣接する2本の信号線に、ゲート電極は共通の走査線にそれぞれ隣接され、前記信号線と外部ドライバーとの接続部または、前数・国と偶数番目の信号線の終端間にTFTスイッチアレイを備えていることを特徴とする。

(作用)

線を駆動するXドライベー、4は走査線を駆動するXドライベー、4は走査駅下下である。2つの絵業下ドである。2つの絵業下ドである。2つの絵業ではれておいてである。ではませんでははいか、ソースでである。信号線にはいるでは、カウントでである。では、カウントでではは、カウントでではは、カウントでではは、カウントででは、大きでは、カウントででは、大きでは、カウントででは、カウントでは、カウントでは、カウントでは、この信号線の終端を投続は、カウントでは、に接続はないる。

通常、このアクティフマトリクスパネルで画像を表示する場合、し...し...とすべてハイレベルとし、スイッチTFT9、10、11をすべてON状態にしておく。この時、X..とX..、X..とX.の様に隣接する2本の信号線には同の信号が与えられる。また、これらの隣接する信号線の信号線の信号線の終端はスイッチTFT11で短絡されている。従って、それぞれの一対の

特開昭64-68724(3)

次に、不良部分の検出方法について説明する。 し、をハイ、し、とし、をローレベルとして画像 を表示した場合を甲、し、をハイ、し、とし、を ローレベルとして画像を表示した場合を乙とする。 甲の場合にはスイッチTFT9がON、スイッチ TFT10と11がOFF状態となり、奇数番目

の信号線のみがXドライバー2で駆動され、各絵 案の左側のTFT6を用いた画像が表示される。 同様に、乙の場合にはスイッチTFT10がON、 スイッチTFT9と11がOFF状態となり、偶 数番目の信号線のみがXドライバー2で駆動され、 各絵素の右側のTFT7を用いた画像が表示され る。この甲と乙の場合の表示画像を比較すること により、前述の配線間の短絡やTFTの電板間の 短絡部分のアドレスを求めることができる。たと えば信号線と走査線が短絡している場合には、そ の部分を中心にクロス状に線欠陥を生じる。一方、 絵業TFTのゲート・ドレイン間が短絡した場合 には、その絵業のみが非点灯となり、ソース・ド レイン間が短絡した場合には、信号線の信号を積 分したデータを書くことになる。ゲート・ソース 間が短絡した場合には、その絵楽のみが非点灯と なるが、かなり低い抵抗で短絡した場合には線欠 陥となる。

他の検査方法としては、プローグカードを用いて電気的に検出する方法もある。

第4図はアクティブマトリクス基板の断面図の例である。30は絶縁基板、31はゲート電極、32はゲート絶縁膜である。チャネル部33、ソース部34、ドレイン部35は、ゲート電極31をマスクにして半導体薄膜中にイオン注入を行い形成する場合と、チャネル部のみ別の膜で形成する場合がある。36は層間絶縁膜、37は信号線、38は絵紫電極である。

〔実施例2〕

第2図は本発明の第2の実施例におけるアクティブマトリクスパネルの回路図の例である。第1の実施例と異なるのは信号線を駆動するXドライバー2、3が半分ずつ上下に配置されている点と、Yドライバー4、5が左右両側に配置され、しかもアクティブマトリクス基板上にTFTで内蔵されている点である。

Xドライバーを上下にくし歯状に配置したのは、 ドライバーの実践ピッチを広げ実装部分の信頼性 を向上させるためであり、逆にこの方式を用いる ことにより高精細なパネルの実装が可能となる。 Yドライバーの動作周波数は数~10数kHzと 遅いため、TFTで構成することは十分可能であ る。内蔵ドライバーであれば、このように両側に 設けて冗長性をもたせてもコストアップにならな い。むしろ、走査線の断線があっても線欠陥を生 じないため、歩留まり向上につながる。

(発明の効果)



完成品の状態で検査をして規格から外れる絵業T FTのみを切断することも可能であり、極めて高 品質の画像を得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図、第3図はアクティブマトリクスパネルの回路図。

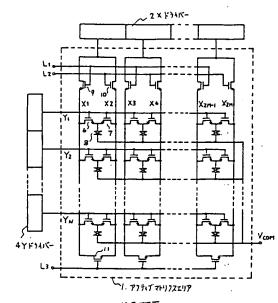
第2図は従来のアクティブマトリクスパネルの 回路図。

第4図はアクティブマトリクス基板の断面図。

- 2 、 3 ··· ··· X ドライバー
- 4 、 5 ··· ··· Y ドライバー
- 6、7……… **检索**TFT
- 9 、 1 0 、 1 1 ····· スイッチTFT

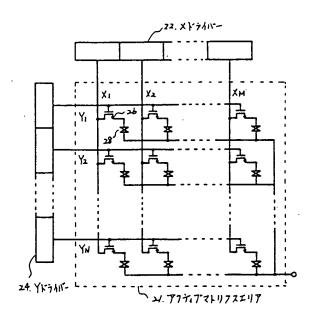
以上

出願人 セイコーエブソン株式会社 代理人弁理士 最上 務 他1名

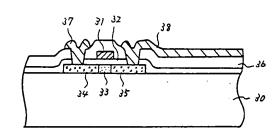


47--- 社委TFT 9.10.11--- スイッチTFT

第1図



第2回



30 --- 紀縁基板

31 --- T-h

32 --- ゲート絶縁膜

33 --- ディネル

34 --- ソース

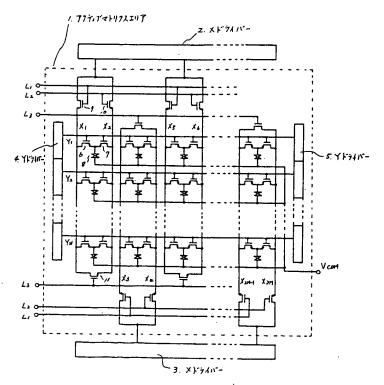
25 --- KU12

30 --- 唐間絕緣膜 37 --- 信号線

-- 45-5-4

第4図

特開昭64-68724 (5)



第3四